

★ディペンダブルコンピューティング研究会 (DC)

専門委員長 金川信康 副委員長 井上美智子

幹事 岩田浩司・土屋達弘

日時 2月13日(金) 10:00~16:50

会場 機械振興会館地下2階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL {03} 3434-8211)

議題 VLSI 設計とテスト及び一般

高信頼化設計

1. 高電磁環境下におけるFPGA若化の検討 ○サイサナソソカム アロムハック・福本 聡(首都大東京)
2. 閾値変更に基づくMLC PCMの高信頼化手法に関する一考察 ○中野伸哉・新井雅之(日大)
3. 近似論理に基づく高信頼設計手法の評価に関する一考察 ○齋藤晴樹・新井雅之(日大)

階層テスト

4. 階層テスト容易化高位合成におけるスケジューリングの一手法
○西間木 淳・細川利典(日大)・藤原秀雄(阪学院大)
5. 階層BIST向けLFSRシード生成法 ○佐脇光亮・大竹哲史(大分大)

午後 特別講演(13:45~)

6. International Test Conference 2014 報告 ITC アジア委員会

セキュリティとテスト

7. 信号非遷移情報に基づくトロイ回路検出法 ○坊屋鋪知拓・細川利典(日大)・吉村正義(京都産大)
8. スキャンベース攻撃を考慮した暗号LSIのテスト手法 ○吉村正義(京都産大)・西間木 淳・細川利典(日大)

故障診断

9. マルチサイクルキャプチャテスト集合を用いた単一論理故障の故障診断法の評価
○高野秀之・山崎紘史・細川利典(日大)・山崎浩二(明大)
10. IR-dropを考慮した抵抗性オープン故障の診断用パターンの選択手法
○王 森レイ・井上大画・ハナン ティ アル アワディー・樋上喜信・高橋 寛(愛媛大)

☆DC研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月6日(金), 7日(土) 奄美市社会福祉協議会〔締切済〕テーマ:組込み技術とネットワークに関するワークショップ ETNET2015

【問合先】

土屋達弘(阪大大学院情報科学研究科)

E-mail: t-tutiya@ist.osaka-u.ac.jp

◎最新情報は, DC研究会ホームページを御覧下さい.

<http://www.ieice.org/iss/dc/jpn/index.html>